

<p>试验箱</p> <p>间歇寿命(IOL)试验系统 (配 K 系数测试装置)</p>	<p>生产商及型号</p> <p>高坤电子科技 GK-PCx16+K-Factor</p>	<p>应用</p> <p>试验应用:</p> <ul style="list-style-type: none">• 器件热力循环试验 Device Cyclic Thermal Stress• 热力抗阻老化 Degradation of Thermal Resistance (焊接线接触面)(Wire Bonded Interface) <p>温度范围: +25°C to +150°C 老化试验 (最大+200°C)</p> <p>应用器件类型:</p> <p>高/低功率金氧半场效晶体管(MOSFET)及绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率循环试验</p> <p>内部尺寸: 1620(宽) x 1320(高) x 1820(深) 毫米</p> <p>测试容量: 12 模块 x 40 被测器件(DUTs)</p> <p>测试电流 IM: 10 毫安, 准确度+/-0.1 毫安</p> <p>测试脉冲宽度 Test Pulse Width:</p>	<p>图片</p> 
---	--	---	--

		400 微秒(μsec) 器件电力供应: 12 x (24Vdc, 60A)	
--	--	---	--